



SCANBOOSTER II

Multifunktionaler JTAG/Boundary Scan Controller



- Controller für Embedded Tests und Programmierung
- große Flexibilität durch multifunktionale I/O-Kanäle für Mixed-Signal -Tests
- Modularität und Skalierbarkeit durch konfigurierbare TAP Interface Cards
- integrierte Kompakteinheit steuerbar über USB 2.0 und GBit-LAN



Parameter	
Anzahl der TAP-Slots	2 (unabhängig und individuell konfigurierbar mit TAP-Einsteckkarten)
maximale TCK-Frequenz	16 MHz (per Software einstellbar)
parallele I/O-Kanäle	32 Mixed-Signal-Kanäle, individuell konfigurierbar als Input, Output, Tri-State, per Software programmierbare VIO 0,9-3,6 V (4 Gruppen mit 8 I/O)
maximale Anzahl von I/O-Modulen	keine
integrierte Technologien	HYSCAN™, ADYCS™

Embedded Test

- Support neuester Technologien wie Processor Emulation Test, FPGA Assisted Test und Embedded Diagnostics Test
- Synchronisation mit den multifunktionalen I/O-Kanälen und ChipVORX-FPGA-Instrumenten

Software

- Integration in Embedded JTAG Solutions Plattform SYSTEM CASCON™
- Plug-and-Play Integration in 3rd Party Systeme
- offener Mix von Test- und Programmierprozeduren in einer Umgebung

Leistungsstärke

- Einsatz modernster Multi-Core-Prozessoren und FPGAs
- gleichzeitiger Betrieb mit bis zu 16 MHz an allen TAPs simultan
- Betrieb mit bis zu 100 MHz an I/O-Kanälen
- Support für Gang-Operationen

Embedded Programming

- Programmierung von Flash-Komponenten wie NAND, NOR, SPI, I²C, eMMC etc. (auch über I/O)
- universelle Programmierung von µControllern
- Programmierung von FPGA/PLD

SCANBOOSTER II

Multifunktionaler JTAG/ Boundary Scan Controller



Adaptierbarkeit

- problemlose Überbrückung von bis zu vier Meter großen Distanzen zum Target ohne TCK-Reduktion
- Software-parametrisierbare I/Os (Slew rate, Impedanz, Terminierung)
- Software-selektierbare Protokolle (JTAG, DAP, COP, SWD, UART, BDM, SBW)

Erweiterbarkeit

- skalierbare Anzahl von einem bis zwei TAPs

🇩🇪 Made in Germany

